

Model AE-381A 超高速・高精度・1MHz/1kHz/120Hz MLCC 用容量检测仪

最适合 MLCC 贴片电容器包装机

### 特 征

- 超高速：0.3msec.[1MHz]、1msec.[1kHz]、8.34msec.[120Hz] ( FAST 测量中的时间 )
- 通过测量值异常检知可得知 2 端子测量时探测头接触不良的情况
- 可 4 端子接触检测
- 测量频率：1MHz/1kHz/120Hz±0.1%(正弦波)
- 可 BIN 测量：C 14 分类及 Out of bin
- 可在串联等效电路和并联等效电路之间切换
- 定电压测量 ( 只适用部分量程 )
- 可 DF 测量[0.0000 ~ 0.5000]、Q 测量[0 ~ 10000]
- C 测量：4 1/2 位数(15000)数字显示、内置比较器功能可 HI/GO/LO 输出
- RS-232C 接口、打印机输出 ( 适合 Centronics 标准配备 )( GP-IB 选购 )
- 间歇性增加测定电流以减少探测头接触的耗损
- 即使在检测中也可打印检测值、统计值、日期、时间



**NEW!****AE·MIC**  
AEMIC CORPORATION**Model AE-381A 超高速・高精度・1MHz/1kHz/120Hz MLCC 用 容量测试仪****SPECIFICATIONS TENTATIVE**

测量范围及基本精确度 (DF≤0.1 周围温度 23℃±5℃)

C 量程	测量范围	分辨率	精确度 [FAST 测量时为下记精确度的 2 倍]			测量电压 [rms]
			1MHz	1kHz	120Hz	
1.5pF	0.0000pF~1.5000pF	0.0001pF	C:±1.0% of rdg±50dg 以内	----	----	1V±5%
		DF:0.0001	DF:±0.005±0.0001×(Cr/Cx) 以内	----	----	0.5V±5%
15pF	0.000pF~15.000pF	0.001pF	C:±0.25% of rdg±25dg 以内	C:±0.25% of rdg±25dg 以内	----	1V±5%
		DF:0.0001	DF:±0.002±0.0005×(Cr/Cx) 以内	DF:±0.002±0.00025×(Cr/Cx) 以内	----	0.5V±5%
150pF	0.00pF~150.00pF	0.01pF	C:±0.15% of rdg±10dg 以内	C:±0.15% of rdg±10dg 以内	----	1V±5%
		DF:0.0001	DF:±0.001±0.0001×(Cr/Cx) 以内	DF:±0.001±0.0001×(Cr/Cx) 以内	----	0.5V±5%
1.5nF	0.0pF~1500.0pF	0.1pF	C:±0.15% of rdg±10dg 以内	C:±0.15% of rdg±10dg 以内	----	1V±5%
		DF:0.0001	DF:±0.001±0.0001×(Cr/Cx) 以内	DF:±0.0005±0.0001×(Cr/Cx) 以内	----	0.5V±5%
15nF	0.000nF~15.000nF	0.001nF	----	C:±0.15% of rdg±10dg 以内	----	1V±5%
		DF:0.0001	----	DF:±0.0005±0.0001×(Cr/Cx) 以内	----	0.5V±5%
150nF	0.00nF~150.00nF	0.01nF	----	C:±0.15% of rdg±10dg 以内	----	1V±5%
		DF:0.0001	----	DF:±0.0005±0.0001×(Cr/Cx) 以内	----	0.5V±5%
1.5μF	0.0nF~1500.0nF	0.1nF	----	C:±0.15% of rdg±10dg 以内	C:±0.15% of rdg±10dg 以内	1V±5%
		DF:0.0001	----	DF:±0.0005±0.0001×(Cr/Cx) 以内	DF:±0.0005±0.0001×(Cr/Cx) 以内	0.5V±5%
15μF	0.000μF~15.000μF	0.001μF	----	C:±0.3% of rdg±20dg 以内	C:±0.15% of rdg±10dg 以内	1V±5%
		DF:0.0001	----	DF:±0.001±0.0002×(Cr/Cx) 以内	DF:±0.001±0.0002×(Cr/Cx) 以内	0.5V±5%
150μF	0.00μF~150.00μF	0.01μF	----	C:±1% of rdg±50dg 以内	C:±0.5% of rdg±25dg 以内	1kHz : 1V/0.5V +5%~-20%
		DF:0.0001	----	DF:±0.005±0.0005×(Cr/Cx) 以内	DF:±0.003±0.0005×(Cr/Cx) 以内	120Hz : 0.5V±5%
1.5mF	0.0μF~1500.0μF	0.1μF	----	----	C:±1.5% of rdg±50dg 以内	120Hz/0.5V+5%~-25%
		DF:0.0001	----	----	DF:±0.01±0.001×(Cr/Cx) 以内	

※测量电压为 0.5V 情况时上记精确度则为 2 倍

测量方式	5 端子 [3 端子] 测量方式
测量频率	1MHz/1kHz/120Hz±0.1%、正弦波
测量讯号输出阻抗	约 2Ω
寄生电容修正范围	约 20pF
满刻度及零度系数	±100ppm/℃以内
测量时间	【空转周期】FAST : 约 1~5 次/秒 SLOW : FAST×N(N:平均值设定次数) 【测量中讯号】FAST : 0.3msec.[1MHz]、1msec.[1kHz]、8.34msec.[120Hz]、
测量范围	Capacitance : 0~15000 DF : 0.0000~0.5000 Q : 0~10000
B I N 测量	C:14 分类及 Out of bin
周围使用环境	温度: 0℃~+50℃、湿度: 85%以下
所需电源	AC85V~265V、50~60Hz、约 50VA
外形尺寸	250(W)×99(H)×300(D)mm (不含底部橡胶等突起部分)
重量	约 3.5kg

G P - I B 选购

○说明书的内容会因机台改良而随时变更,恕不另行通知.

**AEMIC 株式会社**

〒612-8448

京都市伏见区竹田东小屋ノ内町 34 番地

电话:+81-75-612-0710 FAX:+81-75-612-0750

E-Mail: sales@ae-mic.com

http://www.ae-mic.com